

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination	
10/619,181	TAKAHASHI ET AL.	
Examiner	Art Unit	
Jason I Lazorcik	1791	

SEARCHED						
Class	Subclass	Date	Examiner			
		-				

INTERFERENCE SEARCHED					
Class	Subclass	Date	Examiner		
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-		
	1.				
		<u> </u>	<u> </u>		

DATE	EXMR
2/28/2007	JLL
1/14/2008	JLL
_	1/14/2008